

22-23 сентября 2020 года в г. Лыткарино Московской обл. пройдет 23-я Всероссийская научно-техническая конференция «Радиационная стойкость электронных систем» - «Стойкость-2020». В конференции примут участие 45 сотрудников АО «ЭНПО СПЭЛС» с 41 стендовыми и 6 устными докладами.

Устные доклады конференции «Стойкость-2020» от АО «ЭНПО СПЭЛС» и НИЯУ МИФИ:

1. Д.И. Сотсков, В.В. Елесин, А.Г. Кузнецов, Г.В. Чуков, Н.А. Усачев

*«Радиационно-ориентированная и СВЧ-характеризация технологических процессов, применяемых для создания отечественной ЭКБ ТСВЧЭ доверенного назначения: текущее состояние и ближайшие задачи»;*

2. Р.С. Торшин, Д.В. Бобровский, А.А. Демидов, Г.С. Сорокоумов

*«Особенности комплексного тестирования критериальных параметров АЦП во время радиационного эксперимента»;*

3. В.А. Чепов, С.Б. Шмаков, И.И. Швецов-Шиловский

*«Визуализация координат сбойных ячеек памяти в микросхемах СОЗУ после воздействия ионизирующего излучения»;*

4. М.П. Белова, О.Ю. Винокуров, Д.В. Печенкина, Е.Ю. Внукова, М.В. Кадолин, Д.И.Грицаенко, Д.В. Бойченко

*«Стойкость линейных и импульсных стабилизаторов напряжения к накопленной дозе»;*

5. А.Р. Шарипова, А.С. Колосова, А.А. Львович (АО «НИИМЭ»), Д.В. Бойченко

*«Сравнительный анализ эффективности схемотехнических и конструктивно-топологических методов обеспечения стойкости на примере микросхем преобразователя кода»;*

6. П.В. Александрова, К.А. Епифанцев, П.К. Скоробогатов, А.А. Аникин

*«Исследование пассивных электронных компонентов на стойкость к воздействию серии импульсов напряжения».*